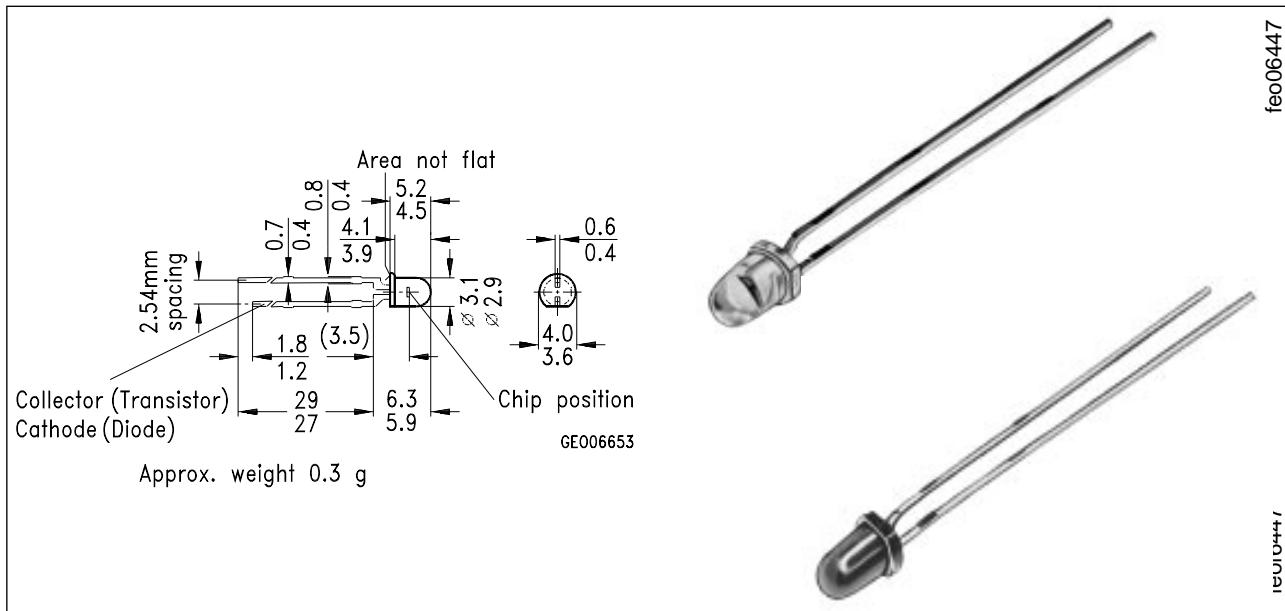


Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time

SFH 229
SFH 229 FA



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 380 nm bis 1100 nm (SFH 229) und bei 880 nm (SFH 229 FA)
- Kurze Schaltzeit (typ. 10 ns)
- 3 mm-Plastikbauförm im LED-Gehäuse
- Auch gegurtet lieferbar

Anwendungen

- Lichtschranken für Gleich- und Wechselbetrieb
- Industrieelektronik
- "Messen/Steuern/Regeln"

Features

- Especially suitable for applications from 380 nm to 1100 nm (SFH 229) and of 880 nm (SFH 229 FA)
- Short switching time (typ. 10 ns)
- 3 mm LED plastic package
- Also available on tape

Applications

- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ (*vorher) Type (*formerly)	Bestellnummer Ordering Code
SFH 229	Q62702-P215
SFH 229 FA (*SFH 229 F)	Q62702-P216

Grenzwerte**Maximum Ratings**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	T_{op} ; T_{stg}	– 55 ... + 100	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3$ s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ($t \leq 3$ s)	T_s	230	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	20	V
Verlustleistung Total power dissipation	P_{tot}	150	mW

Kennwerte ($T_A = 25$ °C)**Characteristics**

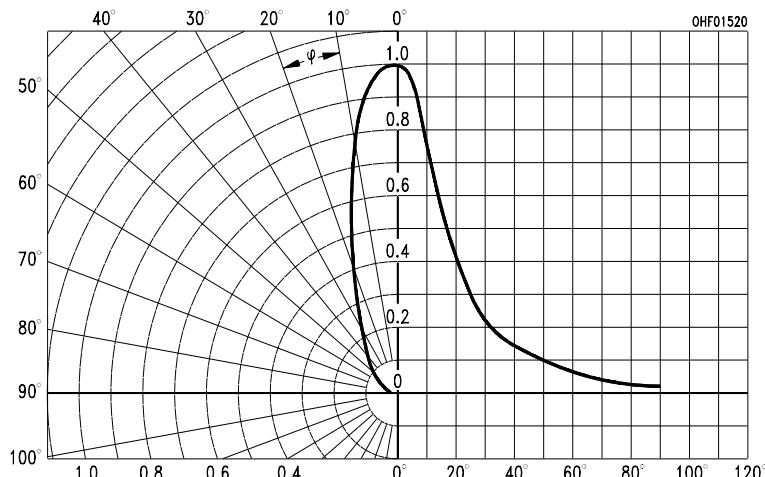
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		SFH 229	SFH 229 FA	
Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_R = 5$ V, Normlicht/standard light A, $T = 2856$ K, $V_R = 5$ V, $\lambda = 950$ nm, $E_e = 1$ mW/cm ²	S	28 (≥ 18)	–	nA/lx
	S	–	20 (≥ 10.8)	μA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S_{max}}$	860	900	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{max}	λ	380 ... 1100	730 ... 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	0.3	0.3	mm ²
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	0.56 × 0.56	0.56 × 0.56	mm × mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuse- oberfläche Distance chip front to case surface	H	2.4 ... 2.8	2.4 ... 2.8	mm

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Characteristics (cont'd)**

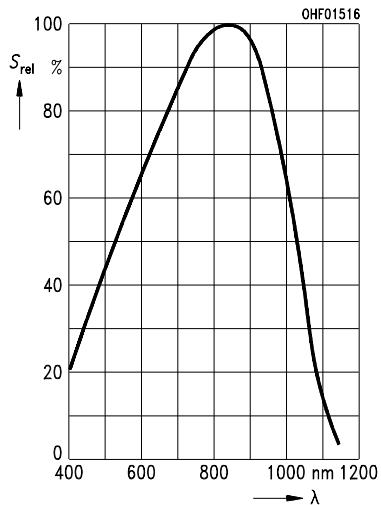
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		SFH 229	SFH 229 FA	
Halbwinkel Half angle	ϕ	± 17	± 17	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_R = 10 \text{ V}$ Dark current	I_R	50 (≤ 5000)	50 (≤ 5000)	pA
Spektrale Fotoempfindlichkeit, $\lambda = 850 \text{ nm}$ Spectral sensitivity	S_λ	0.62	0.60	A/W
Quantenausbeute, $\lambda = 850 \text{ nm}$ Quantum yield	η	0.90	0.88	Electrons Photon
Leerlaufspannung Open-circuit voltage	V_O	450 (≥ 400)	—	mV
$E_v = 1000 \text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $T = 2856 \text{ K}$	I_{SC}	27	—	μA
$E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 950 \text{ nm}$	I_{SC}	—	9	μA
Kurzschlußstrom Short-circuit current	t_r, t_f	10	10	ns
$E_v = 1000 \text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $T = 2856 \text{ K}$	C_0	13	13	pF
$E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 950 \text{ nm}$	TC_V	— 2.6	— 2.6	mV/K
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent	TC_I	0.18	—	%/K
$R_L = 50 \Omega$; $V_R = 10 \text{ V}$; $\lambda = 850 \text{ nm}$; $I_p = 800 \mu\text{A}$		—	0.2	
Durchlaßspannung, $I_F = 100 \text{ mA}$, $E = 0$ Forward voltage	V_F	1.3	1.3	V
Kapazität, $V_R = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $E = 0$ Capacitance				
Temperaturkoeffizient von V_O Temperature coefficient of V_O				
Temperaturkoeffizient von I_{SC} Temperature coefficient of I_{SC}				
Normlicht/standard light A $\lambda = 950 \text{ nm}$				

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Characteristics (cont'd)**

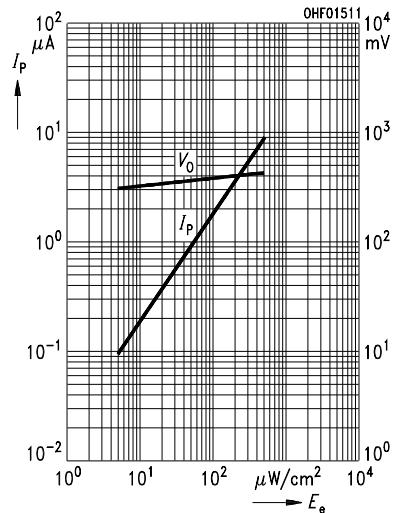
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		SFH 229	SFH 229 FA	
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_R = 10 \text{ V}, \lambda = 850 \text{ nm}$	NEP	6.5×10^{-15}	6.5×10^{-15}	$\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
Nachweisgrenze, $V_R = 10 \text{ V}, \lambda = 850 \text{ nm}$ Detection limit	D*	8.4×10^{12}	8.4×10^{12}	$\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$

Directional characteristics $S_{\text{rel}} = f(\phi)$ 

Relative spectral sensitivity $S_{\text{rel}} = f(\lambda)$
SFH 229

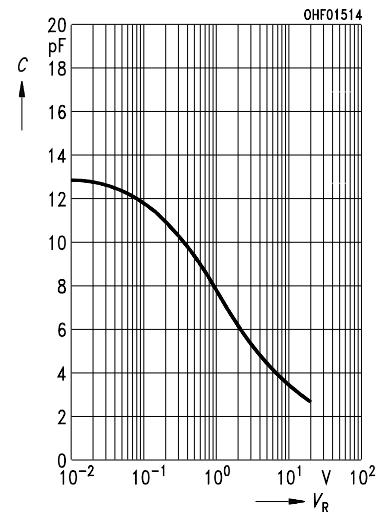


Photocurrent $I_P = f(E_e)$, $V_R = 5 \text{ V}$
Open-circuit voltage $V_O = f(E_e)$
SFH 229 FA



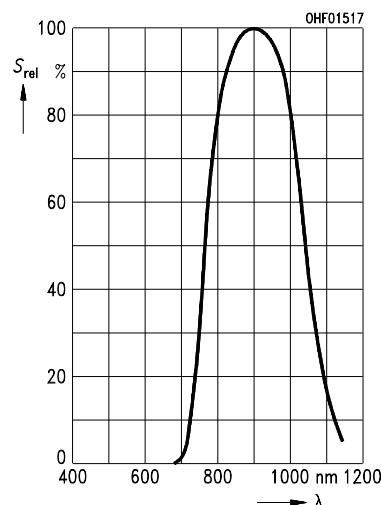
Capacitance

$C = f(V_R)$, $f = 1 \text{ MHZ}$, $E = 0$

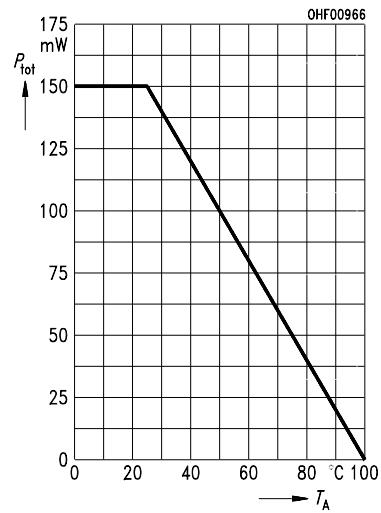


Semiconductor Group

Relative spectral sensitivity $S_{\text{rel}} = f(\lambda)$
SFH 229 FA

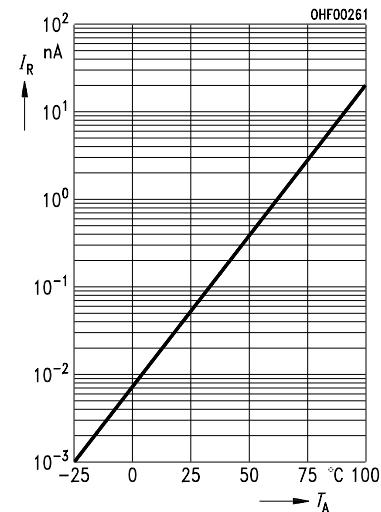


Total power dissipation
 $P_{\text{tot}} = f(T_A)$

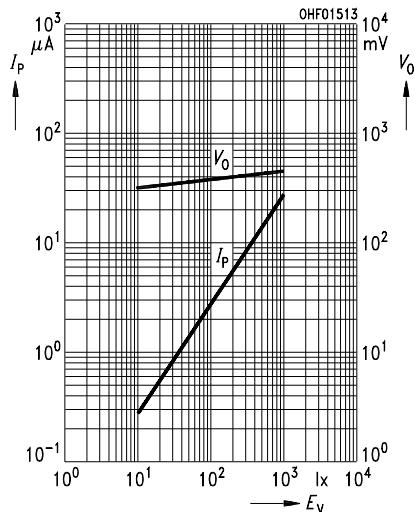


Dark current

$I_R = f(T_A)$, $V_R = 10 \text{ V}$, $E = 0$



Photocurrent $I_P = f(E_V)$, $V_R = 5 \text{ V}$
Open-circuit voltage $V_O = f(E_V)$
SFH 229



Dark current

$I_R = f(V_R)$, $E = 0$

